

| CCMicro : état des lieux des MEB et MET disponibles (CIRIMAT et Castaing) | | | 28 février 2017 |
|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| Appareil | Spécificités | Lieux | Responsables |
| MEB LEO 435VP | Source W, Vide P (< 400 Pa), EDS Imix PGT : détecteur Ge, refroidissement N2 liq | ENSIACET | D. Oquab, Y. Thebault |
| FEI Quanta450 | Source W, pression contrôlée et mode environnemental (< 2600 Pa), EDS Quantax Bruker SDD 30mm ² | ENSIACET | D. Oquab, Y. Thebault |
| MEB JEOL JSM6510LV | Source W, analyseur RX PGT Spirit, obligation maintenance N2liq | UPS Chimie 2R1 Salle 1087 B | J.-J. Demai |
| MEB JEOL JSM6400 | Source W, analyseur RX Oxford Inca | UPS Chimie Salle 17 | J.-J. Demai |
| Pulvérisateur cathodique Edward S150B | Métallisation Argent | UPS Chimie Salle 17 | J.-J. Demai |
| Pulvérisateur cathodique JEOL JFC1200 | Métallisation Argent | UPS Chimie 2R1 Salle 1087 B | J.-J. Demai |
| Pulvérisateur cathodique Cressington | Métallisation Argent, Or, Platine. Mesure des épaisseurs par quartz. | UPS Chimie Salle 15 | M.-C. Barthelemy |
| MEB JEOL 7800F Prime | FEG cathode chaude, EDS SDD Oxford AZTEC, imagerie électronique à des résolutions sub-nanométriques ; microanalyse EDS/SDD ultra rapide et ultra fine | UMS Castaing | C. Josse |
| MEB JEOL 7100F TTLS-LV | FEG cathode chaude - LV (jusqu'à 300 Pa), EDS SDD - EBSD Oxford AZTEC - Channel 5, imagerie électronique haute résolution à basse tension - Observation et analyse d'échantillons isolants sans métallisation (mode basse pression), microanalyse EDS/SDD, analyse structurale via EBSD et EBSD en transmission (TKD) | UMS Castaing | C. Josse |
| MEB JEOL 6700F | FEG cathode froide, EDS Si/Li PGT Spirit, imagerie électronique haute résolution; microanalyse EDS/SiLi | UMS Castaing | S. Le Blond du Pouy |
| MEB FEI HELIOS 600i FIB | Double colonne : FEG/FIB, EDS SDD Oxford instruments - EDS 3D, imagerie MEB et microanalyse EDS/SDD à haute résolution ; fabrication à l'échelle nanométrique de lames TEM ; imagerie et microanalyse en cross-section; imagerie et micro-analyse en 3D | UMS Castaing | C. Josse |

| | | | |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| MET JEM 1011 | MET 100kV, Filament W, Résolution 4,5 Å, Imagerie de routine | UMS Castaing | L. Datas, L. Weingarten |
| MET JEM 1400 | MET 120kV, Filament W, Résolution 3,8 Å, Imagerie de routine | UMS Castaing | L. Datas, L. Weingarten |
| MET JEM 2010 | MET 200kV, Filament LaB6, Résolution 2,3 Å pt, EDX, Appareil dédié analyse et diffraction | UMS Castaing | L. Datas, L. Weingarten |
| MET JEM 2100F | MET 200kV, FEG Schottky, Résolution 2,3 Å pt / 1 Å ligne, TEM, STEM, EDX, Porte objet simple tilt, double tilt, cryo, environnemental, Appareil dédié Imagerie, analyse TEM et STEM, diffraction | UMS Castaing | L. Datas, L. Weingarten |
| MET JEM ARM200F | MET 200kV COLD FEG Corrigé Sonde, Résolution TEM 1,9 Å pt / 1 Å ligne , Résolution STEM 0,78 Å, TEM, STEM Corrigé, EDX, EELS (EFTEM , STEM EELS), Porte objet simple tilt, double tilt, Appareil dédié à l'imagerie et l'analyse à l'échelle atomique en mode STEM | UMS Castaing | L. Datas, T. Hungria |